 Sear	ch N	otes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/675,796	ISHIKAWA ET AL.
Examiner	Art Unit
Staven A. Deens	4772

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
428	845.6	11-16-05	Sir
	!		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
			·
	<u> </u>		

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH	TES STRATEGY	<b>'</b> )
	DATE	EXMR
		-
	<u> </u>	
	:	
	-	